



ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.

Δρ Κ.Ι. ΒΑΜΒΑΚΑΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
SPM SCANNING PROBE MICROSCOPY & AFM ATOMIC FORCE MICROSCOPE
VEECO
Πέμπτη 3 Απριλίου 2008

Η Εταιρεία VEECO – πρωτοπόρος στη Μετρολογία – συνεχίζει να πρωτοστατεί στην ανάπτυξη σύγχρονων τεχνικών και νέων εφαρμογών. Στα πλαίσια αυτά η Εταιρεία μας, σε συνεργασία με τον οίκο Veeco, έχει την τιμή να σας προσκαλέσει την Πέμπτη 3 Απριλίου 2008 και ώρα 09:00 στο Ξενοδοχείο «CAPSIS», Μοναστηρίου 18 Θεσσαλονίκη, Αίθουσα ΒΕΡΓΙΝΑ ΙΙ, για τις νεώτερες εξελίξεις στον τομέα της **Μικροσκοπίας Σάρωσης Ακίδας (SPM) & Μικροσκοπίας Ατομικής Δύναμης (AFM)**.

Οι ομιλίες θα δοθούν από τον ειδικό επιστήμονα Dr. Hartmut Stadler. Θα υπάρχει εγκατεστημένο όργανο AFM (Model Innova), το οποίο θα επιδειχθεί κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου. [Υπάρχει επίσης δυνατότητα λεπτομερέστερης επίδειξης του οργάνου την Παρασκευή 4/4/08 κατόπιν συνεννόησης].

09.00-09.30 *Προσέλευση – Καφές- Αναψυκτικά*

09:30-09:35 Welcome to the Seminar

Δ. Σταμέλος

09.35-09:45 Veeco Introduction

Dr. H. Stadler

09:45-10:45 Scanning Probe Microscopy
New Trends & Developments

Dr. H. Stadler

10:45-11.00 *Διάλειμμα - Καφές - Αναψυκτικά*

11:00-12:00 SPM/AFM Applications Materials, Polymers and
Biological samples

Dr. H. Stadler

12:00-12:30 *Ελαφρύ γεύμα*

12:30-13:00 Innova – Versatile SPM System for research

Dr. H. Stadler

13:00:16:00 Workshop with Innova and questions

Θα δοθεί *Βεβαίωση Συμμετοχής* σε όσους παρακολουθήσουν το Σεμινάριο Μετρολογίας VEECO.

Παρακαλούμε επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας μέχρι το αργότερο Τρίτη 1 Απριλίου 2008, στην κα Ράνια Γεωργίου, τηλ. 210-6748973 (εσωτ. 810) ή fax 210-6748978, ή e-mail rgeorgiou@analytical.gr

Με εκτίμηση,
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕ

Δ. Σταμέλος
Χημικός
Δ/ντής Πωλήσεων Veeco